

# 硬X線XAFSビームラインⅡ(BL11S2) -概要

# ビームライン



## ◆測定対象元素

Н				K吸	収端	での》	則定	可能:	元素								Не
Li	Ве			L吸	収端	での》	則定す	可能:	元素			В	U	Ν	0	F	Ne
Na	Mg											Αl	Si	Р	S	C	Ar
Κ	Ca	Sc	Ti	>	Cr	Mn	Fe	Со	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
Rb	Sr	Υ	Zr	Nb	Мо	Тс	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Те	Ι	Хe
Cs	Ва	*1	Hf	Та	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	TI	Pb	Bi	Ро	Αt	Rn
Fr	Ra	*2	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg	Cn	Nh	FI	Мс	Lv	Ts	Og

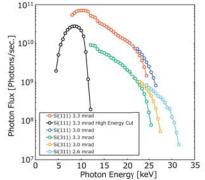
四象限スリット

\*2 Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr

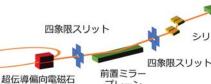
# ビームサイズ (@3.3 mrad集光点) 1011

### ◆ビームライン性能 エネルギー範囲 5 ~ 30 keV 分解能(E/ΔE)

>7000 @12 keV ※Si(111) 計算值 シリンドリカル(3.3 mrad) HO.5 x WO.5 mm シリンドリカル(3.0 mrad) H1.0 x W4.0 mm シリンドリカル(2.6 mrad) H2.0 × W7.0 mm H3.0 × W28.0 mm ■



# ◆ビームライン光学系



前置ミラー (Ptコート)

結晶分光器\* Si(111), Si(311)

> \*分光結晶及び後置ミラーはチャンバー内 でモーター駆動により任意に選択可能

高次光除去ミラ

(Auコート)

# エンドステーション

# ▶検出器

イオンチャンバ (応用光研)



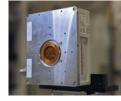


7素子SDD

(テクノエーピー)

転換電子収量法チャンバ X線sCMOSカメラ (旭工業所) (浜松ホトニクス)





# ◆測定環境

ンドリカル、プレ (Pt□-ト)



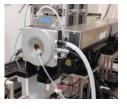
クライオスタット

(仁木工芸)

コールドヘッドとサンプルステ ジ間をサファイアロッドで接続 することにより、サンプルステ-ジを100℃まで昇温した場 合でもコールドヘッドは30℃ 程度に保たれる

冷却加熱ステージ (リンカム社)

スリット



石英セル[透過/蛍光] (幕張理化学硝子製作所)



ガス供給・排気設備  $(H_2, O_2, He, N_2)$ 



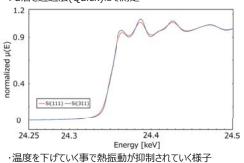
		度[℃]	制御レート[℃/min.]	温調方向	ガス雰囲気	測定手法	
	下限	上限					
蛍光フローセル	室温	800	30	昇温のみ	不活性/可燃/支燃	蛍光	
透過フローセル	室温	900	30	昇温のみ	不活性/可燃/支燃	透過	
リンカム	-190	600	150 (≥0°C) 30 (<0°C)	昇温/降温	不活性	透過/蛍光	
クライオスタット	-250	100	2	昇温/降温	真空	透過/蛍光	

 $N_2$ での希釈や、吸着材を使用する等の安全対策を実施することで、高圧ガスを持ち込み測定を行 う事も可能。(持ち込みガスや実験条件など事前にご相談ください)

# 測定例

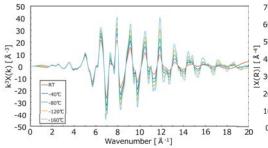
# XAFS測定(透過法、蛍光法、転換電子収量法)

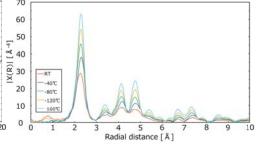
·Si(111)、Si(311)分光結晶によるスペクトルの比較 Pd箔を透過法(Quick)にて測定



20 k<sup>3</sup>X(k) [ Å<sup>-3</sup>] 0 -10 -20 b 15 17 Wavenumber [ Å -1]

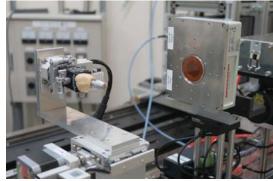
冷却加熱ステージ(リンカム)を用いて、温度を下げながらCu箔を透過法(Quick)にて測定





# ◆位置分解測定(2D、3D-XAFS)

集光ビーム(通常Φ0.5 mm、ポリキャピラリ使用でΦ25 μm)を使 用した蛍光の元素マッピングや、平行ビームと二次元検出器を用い た2D、3D-XAFS測定について整備を進めている。リニアコンビネー ションフィッティングにより、二次元や三次元での価数分布評価が可 能となる



・3D-XAFS測定の様子

試料の回転ステージは組み替える事でX、Z軸どちらの方向にも回 転させる事が可能

粉末X線回折用の試料ホルダーを流用しており、キャピラリ―や細い チューブ等に試料をつめて測定を行う。

エネルギー点数にもよるが、価数の分布について解析を行う際の測 定時間は4時間程度必要



# 硬X線XAFSビームラインⅡ (BL11S2) -成果例-

# 2次元(2D)/3次元(3D) XAFS測定環境の構築

# 1. 背景

### ◆ 2D/3D XAFSの特徴

- サンプル内の状態分布を2D/3Dで調べることができる。
- 集光光をスキャンし面内分布を測定する場合と比べ、測定時間が短い。
- 3Dの場合はサンプル形状に制約がある。(方向を変えても光が透過する。)

### ♦ BL11S2で2D/3D XAFSを測定する利点

- BLに平行化ミラーがあるため、光の面内におけるエネルギー分布が小さい。
- 集光した光を利用した通常のXAFS測定への切り替えが容易である。
- 測定や解析用のプログラムを公開している。

### 2D/3D XAFS測定の実現に向けた取り組み内容

- プレーンミラーの導入
- ステージや検出器などの測定機器の整備
- 測定および解析プログラムの開発
- 測定手順の最適化

# 2. 実験条件

◆ 現在のBL11S2の光学系







後置ミラーにプレーンミラーを追加。

集光した光はシリンドリカルミラー、広がった光はプレーンミラーを使用し測定。 2種類のミラーは20~30分ほどで切り替え可能。

## ◆ 測定セットアップ





広がった光を使用した測定例

集光した光を使用した測定例

のイメージ

### サンプルステージ

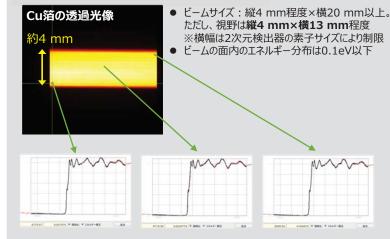
● 3D XAFS対応(水平、垂直、回転機構あり)

# 2次元検出器

- 浜松ホトニクス社製 X線sCMOSカメラ C12849-111U
- 画素サイズ: 6.5 µm (H) ×6.5 µm (V) ※分解能は13 µm程度
- 有効素子サイズ: 13.312 mm (H) ×13.312 mm (V)

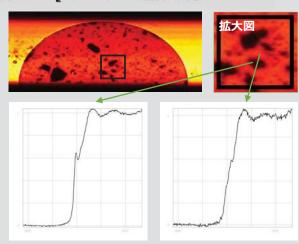
# 3. 実験結果

◆ 結果1:ビームサイズと面内のエネルギー分布



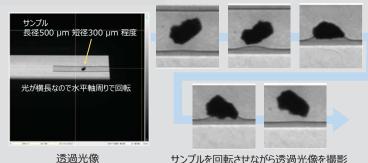
3点のXAFSスペクトル間でエネルギーシフトは見られない。 ビーム面内においてエネルギー分布がないことを確認。

### 結果 2: Cu<sub>2</sub>O、CuO、BNの混合ペレットの2D XAFS

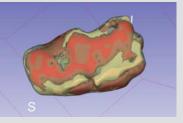


化学状態の2次元分布を解析可能。

# ◆ 結果3: 隕石の3D XAFS (サンプル提供: 東京大学 高橋嘉夫教授)



サンプルを回転させながら透過光像を撮影



化学状態の3次元分布を解析可能。

2D、3D XAFSの測定をご検討の方は、利用申請の前に必ずご相談ください。 謝辞 本研究は、名古屋大学 田渕雅夫教授のご指導の下、実施されました。